ПОЛУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОЙ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ВІМЕVOX

Ласкин Р.С.⁽¹⁾, Крылов А.А.^(1,2), Буянова Е.С.⁽¹⁾
⁽¹⁾ Уральский федеральный университет 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19
⁽²⁾ Институт металлургии УрО РАН 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 101

В настоящее время повышенный интерес вызывает энтропийная стабилизация кристаллических структур в оксидных системах. Изменяя состав исходного вещества путем ведения допантов, можно значительно улучшить функциональные характеристики нового материала относительно недопированного соединения (увеличение электропроводности, расширение температурного диапазона применяемости, стабилизация необходимой фазы и т.д.). Многоэлементное допирование (4-мя и более металлами) является одним из направлений получения высокоэнтропийных оксидов. Поэтому целью работы стала модификация ванадата висмута $\text{Вi}_4\text{V}_2\text{O}_{11}$ для получения составов семейства BIMEVOX (замещенные ванадаты висмута) с помощью многоэлементного допирования подрешетки ванадия Ca, Mg, Y, Ta, Ti, Zr, Nb, Fe в различных сочетаниях.

Синтез замещенных ванадатов висмута с общими формулами $Bi_4V_{1.7}M_{0.3}O_{11-\delta}$ (где M – $Me^1_{0.075}+Me^2_{0.075}+Me^3_{0.075}+Me^4_{0.075}$, Me=Ca, Mg, Ta, Nb, Ti, Zr, Y, Fe) и $Bi_4V_{1.8}M_{0.2}O_{11-\delta}$ (где M – $Me^1_{0.05}+Me^2_{0.05}+Me^3_{0.05}+Me^4_{0.05}$, Me=Ca, Mg, Ta, Nb, Ti, Zr, Y, Fe) был проведен твердофазным методом в температурном интервале от 673 K до 1073 K с шагом в 100 градусов и промежуточными перетираниями в агатовой ступке в среде этилового спирта после каждой стадии отжига.

Аттестацию промежуточных и конечных продуктов проводили с помощью рентгенофазового анализа ($P\Phi A$). По результатам $P\Phi A$ были установлены структурные характеристики полученных материалов. Оценены параметры элементарных ячеек образцов. Средний размер частиц синтезированных порошков определен с помощью метода лазерной дифракции.

С целью дополнительной аттестации и проведения анализа пористости спеченных брикетов была проведена оценка морфологии поверхности и элементного состава образцов с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Результаты согласуются с данными, полученными с помощью $P\Phi A$.

Общая электропроводность образцов исследована методом импедансной спектроскопии в интервале температур 1073—473 К в режиме охлаждения. По результатам измерений получен набор годографов импеданса для каждого из образцов. Обработка годографов производилась с помощью эквивалентных схем, типичных для семейства ВІМЕVOX. В результате получены температурные зависимости удельной электропроводности в Аррениусовских координатах, оценены температурные коэффициенты проводимости.